

東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構 AAVLI INSTITUTE FOR THE PHYSICS AND MATHEMATICS OF THE UNIVERSE

CdTe半導体検出器を用いたミュオンX線の撮像

Nov. 27, 2020 桂川 美穂

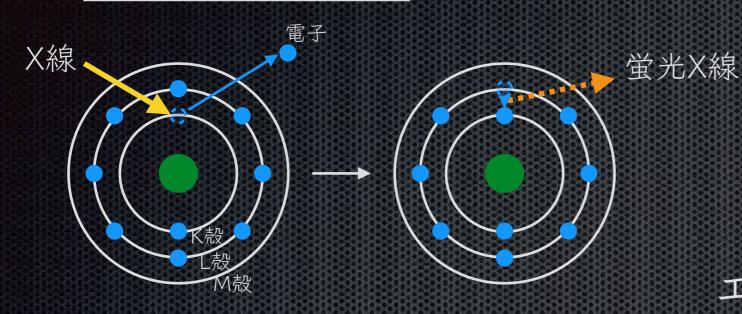
東京大学カブリIPMU

Outline

- * ミュオンX線を用いた非破壊分析の現状と課題
- * CdTe半導体検出器を用いた小型カメラの開発
- *J-PARCにおける実験
- * まとめ

非破壊分析

物質にダメージを与えることなく構成元素や量、分布を特定する分析手法 蛍光X線分析(XRF)



- * 表面の物質
- * Na (> 1 keV) よりも原子番号 が大きい元素

軽元素からの蛍光X線は、 エネルギーが小さすぎる!!

ミュオンX線分析

蛍光線 Ke:54.3 eV μ<u>·</u>:負ミュオン

 $(m_{\mu} = 207 m_e)$

- * 軽元素の解析(Li, Be, B, C, N, O, …)
- * 深層部の解析

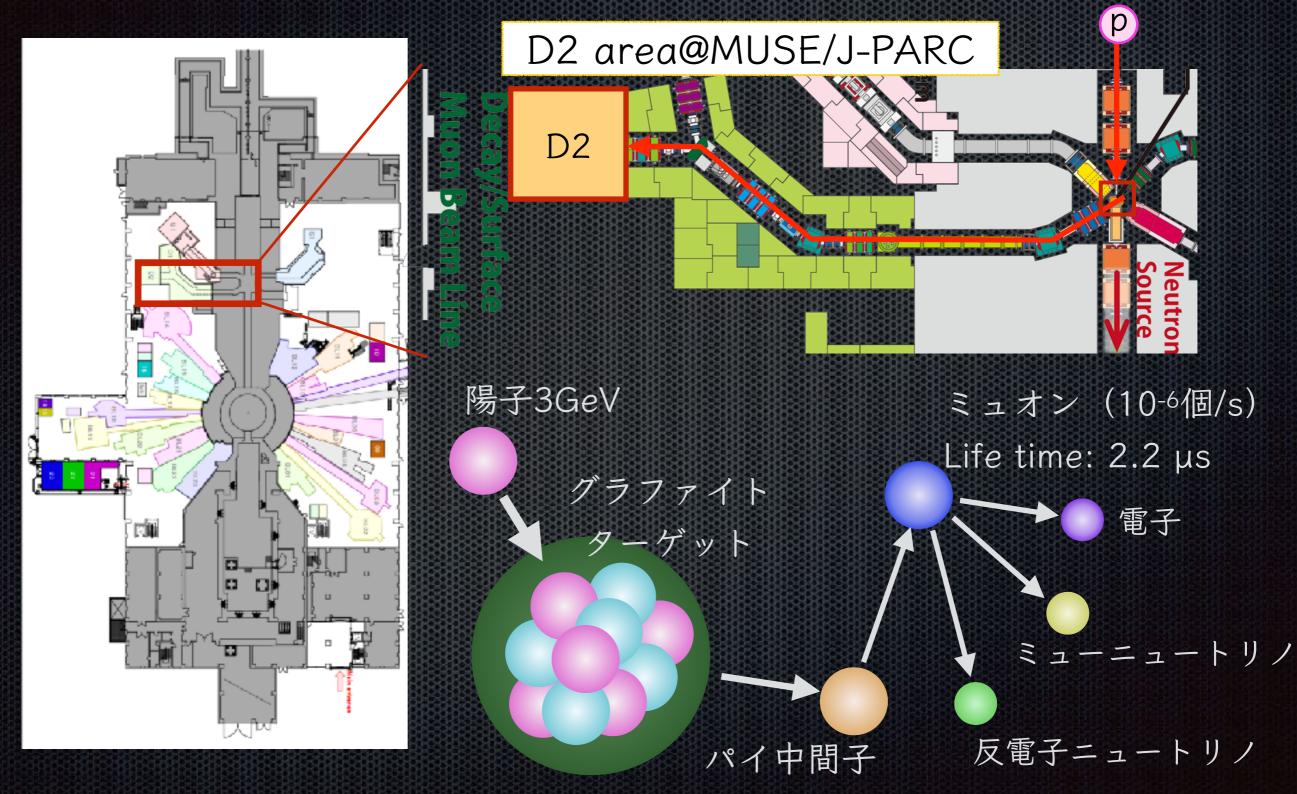
大強度の負ミュオンビームと硬X線撮像器があれば、

ミュオンX線を用いた3次元非破壊分析が可能になる。

ミュオン特性X線 K_µ:18.7 keV

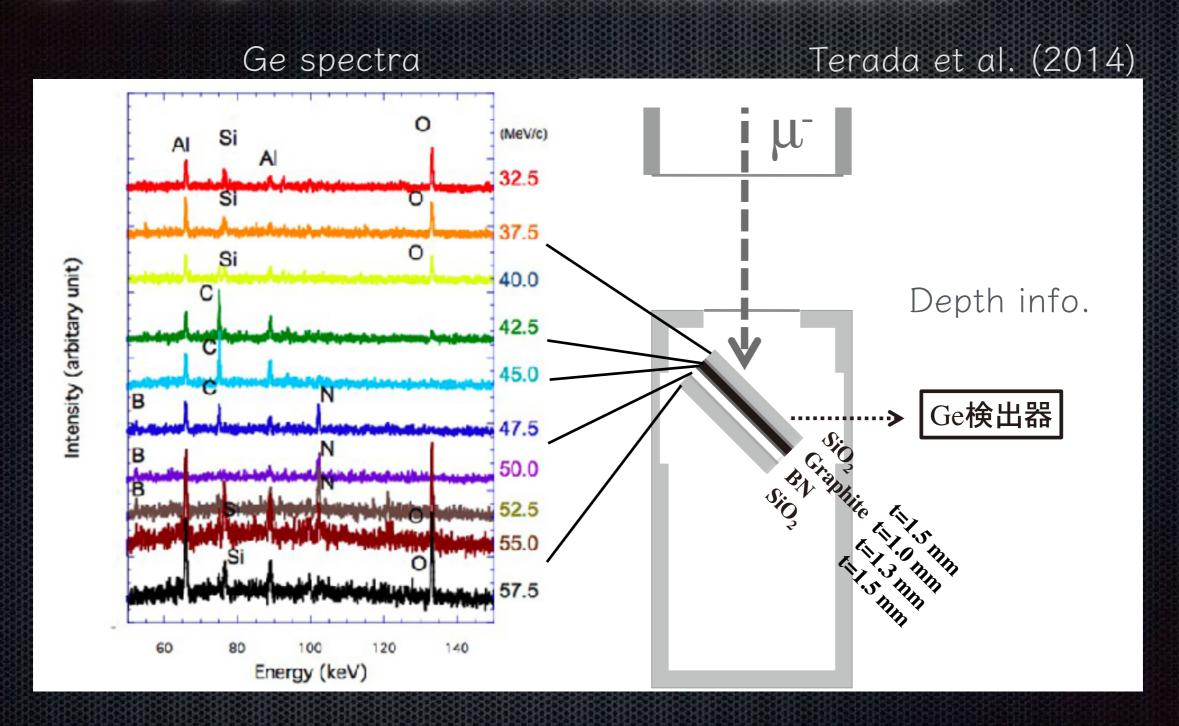
Li原子核

ミュオンビーム@J-PARC



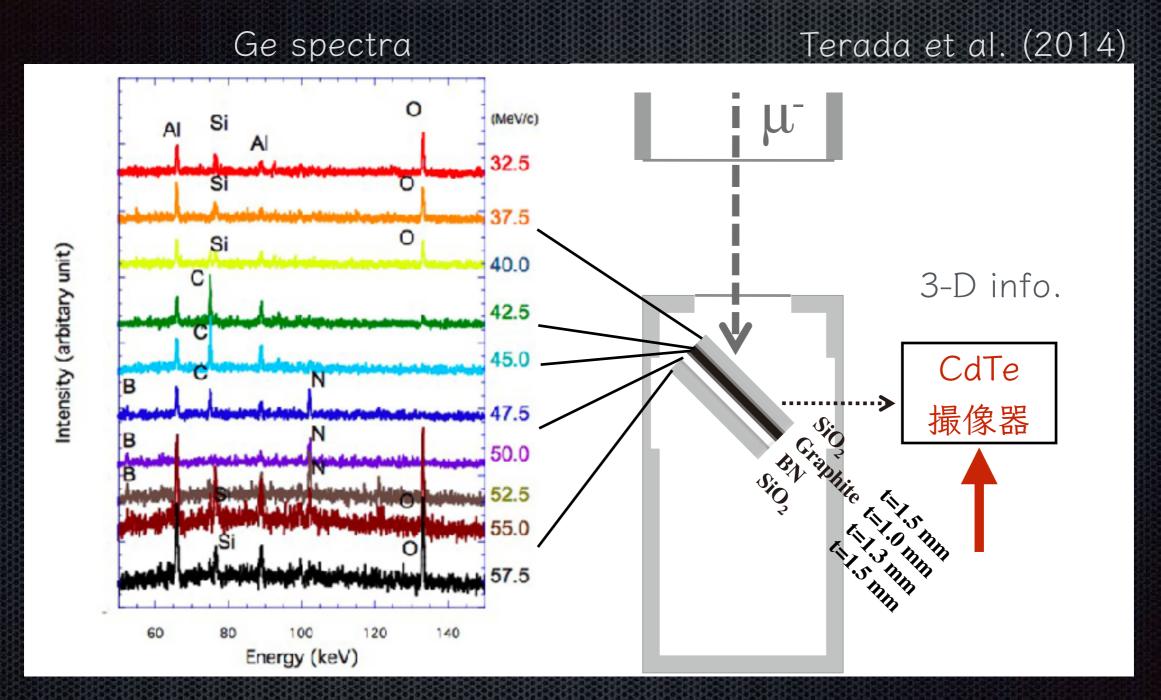
Life time: 26 ns

ミュオンX線の1次元測定



<u>ただし、スペクトル情報のみ!</u>

ミュオンX線の1次元測定

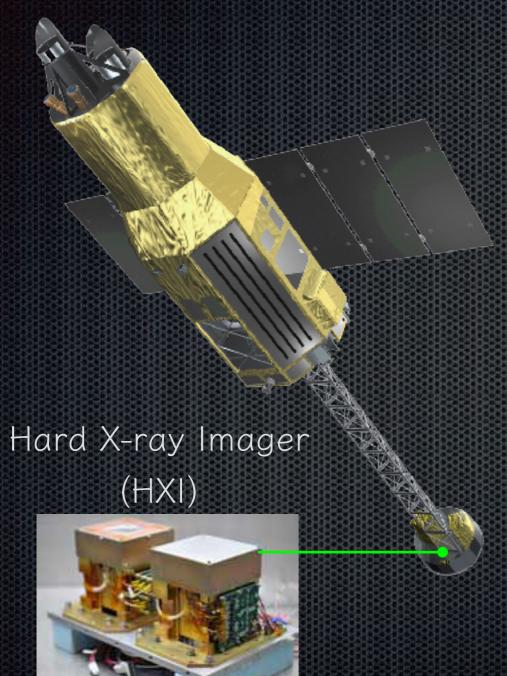


New approach

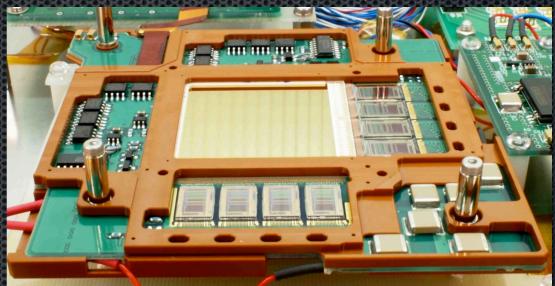
2次元情報(硬X線撮像)を取り入れて3次元撮像を可能にする。

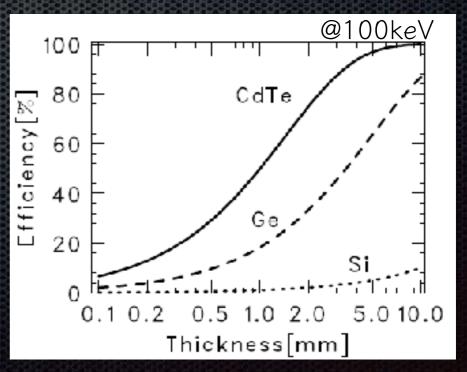
宇宙観測用CdTe半導体検出器

ASTROーH(ひとみ衛星)

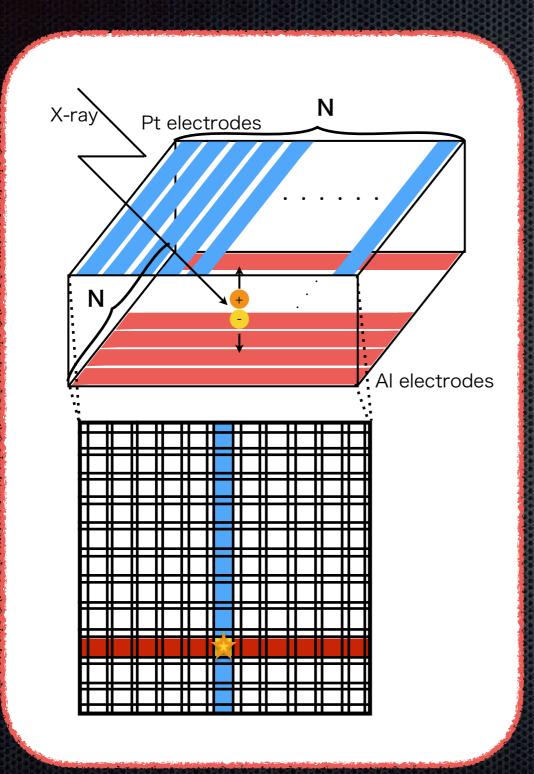


両面ストリップ型CdTe検出器 CdTe double-sided strip detector (CdTe-DSD)





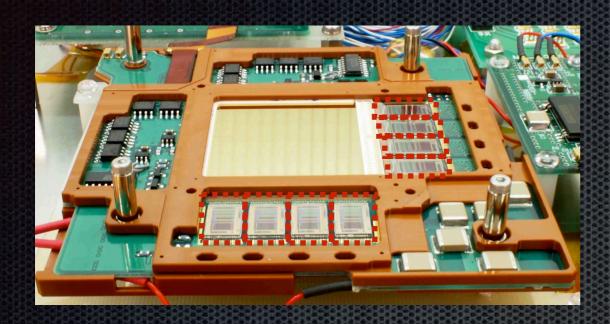
CdTe半導体素子

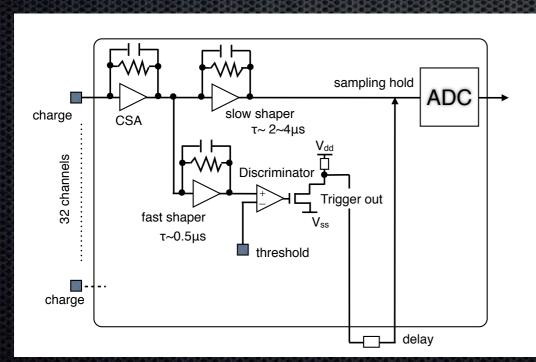


- At, Ptのストリップ電極を各面に直交する様にとりつけた両面ストリップ型検出器
 少ない読み出しチャンネルの減少による小型化(Strip: 2N, Pixel: NxN)
- ▶ Al/p-CdTe構造によるCdTe ダイオード
 - -> High energy resolution

ACRORADとの共同開発

読み出しASIC



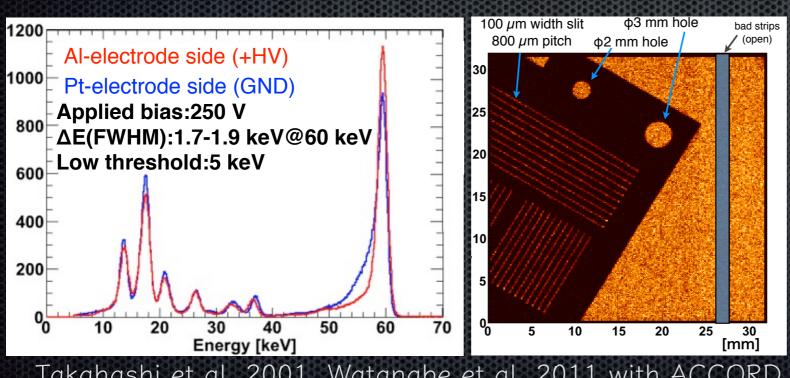


Tajima et al. (2010)

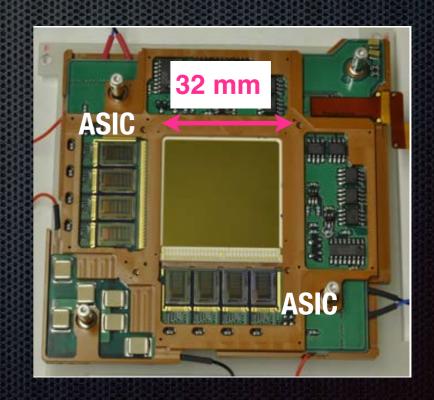
- 64チャンネル読み出しASICx8
- Fast shaper トリガーを生成 τ~0.5μs
- Slow shaper サンプルホールド τ~約2μs
- Internal ADCによってASIC以降は デジタル信号 Wilkinson type
 Common mode Noise Subtraction

CdTe-DSD

- 1. 高い検出感度 <100 keV
- 高いエネルギー分解能 ~1-2 keV@60 keV
- 細かい電極幅 < 250 μm + 広い検出面積 (32 mm x 32 mm) 3.
- 4. 小型/低バックグラウンド

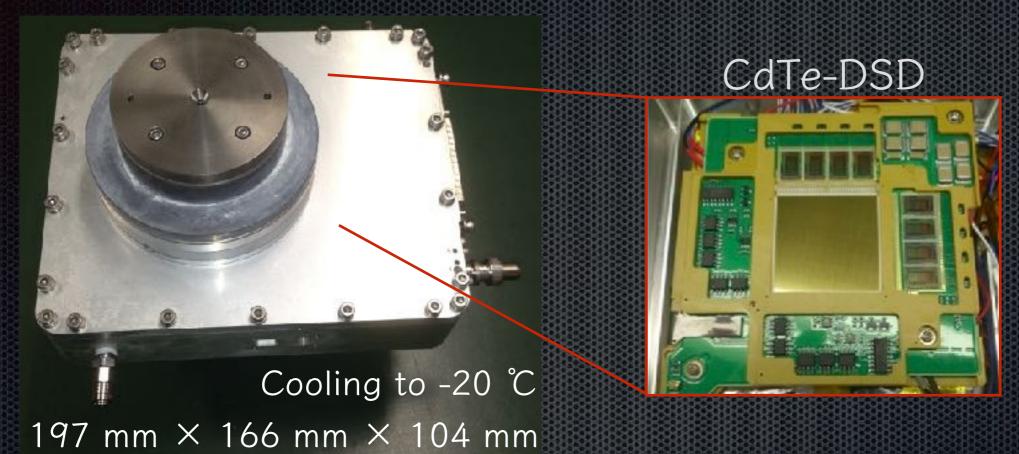




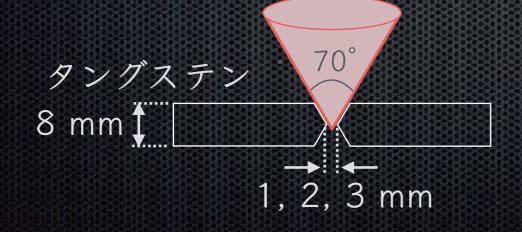


小型硬X線カメラ

CdTe-DSD + Pinhole optics + Graded-Z shield + Peltier Cooler

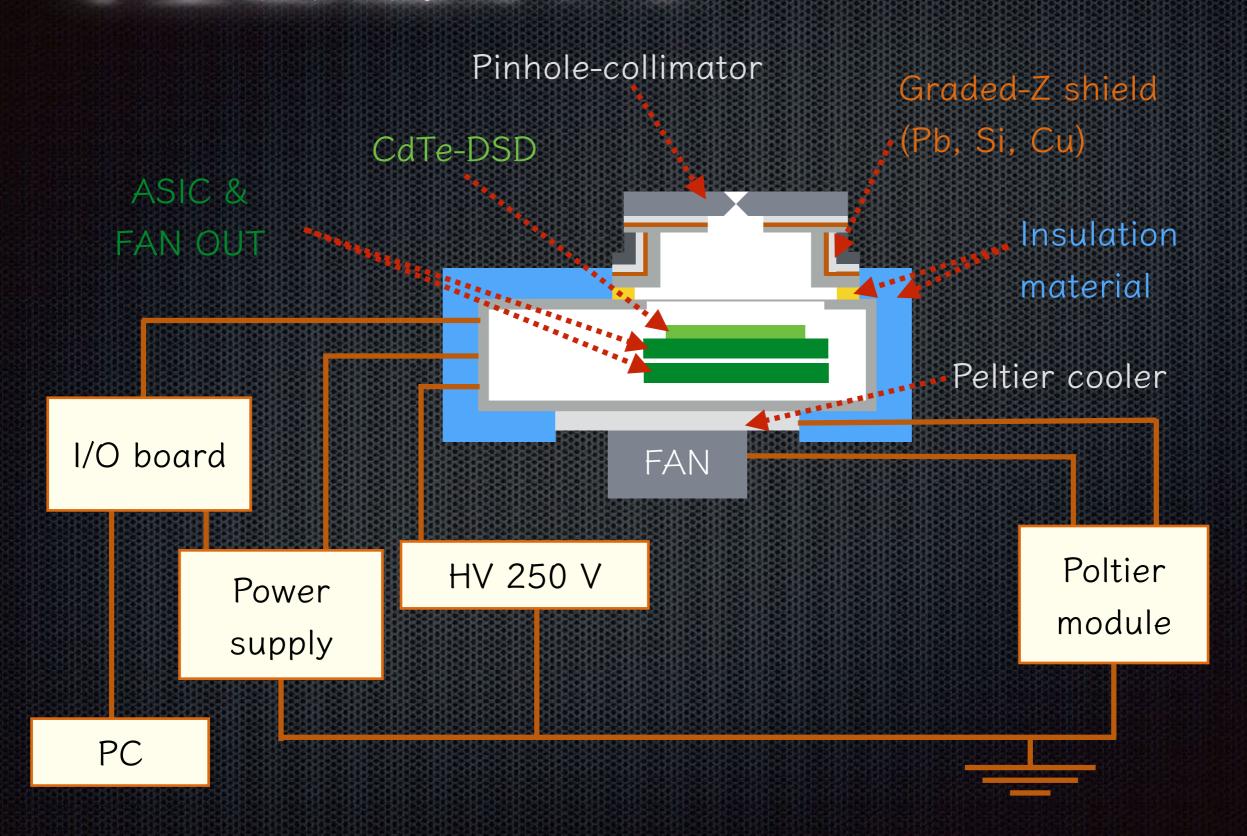


バックグラウンド低減のためのピンポール&シールド



- * ナイフエッジ加工による広視野の確保。
- * 視野外からの硬X線を遮蔽する グレーデッドZシールド (Pb, Sn, Cu)。

小型硬X線カメラ



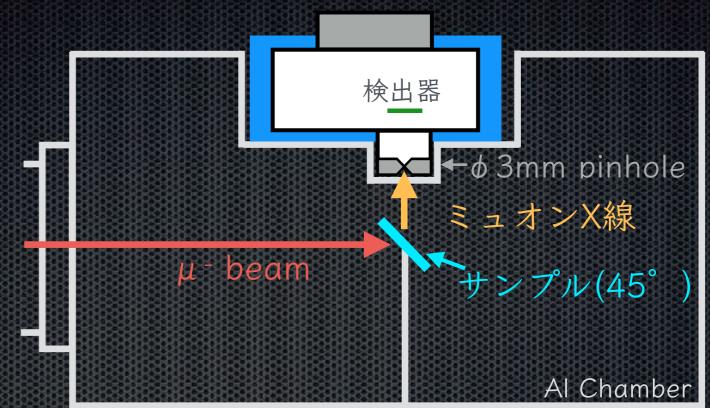
Setup

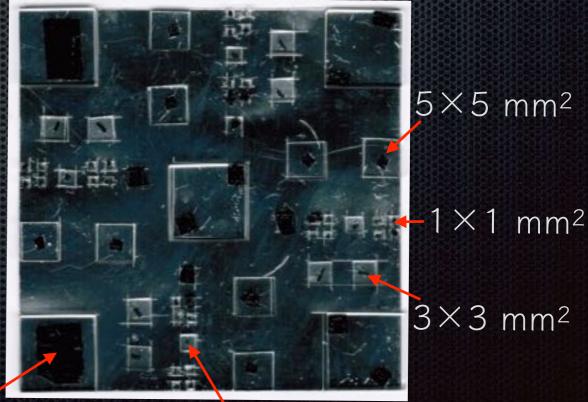
μ-ビーム運動量

45, 50 MeV/c

AI/BN/AI サンプル

(layer : Al (1.5 mm^t) 2nd layer : BN (1 mm^t)3rd layer : LiF (1 mm^t) 4th layer : Al (0.1 mm^t) Boron Nixride (BN) 50 mm 50 mm 3.6 mm



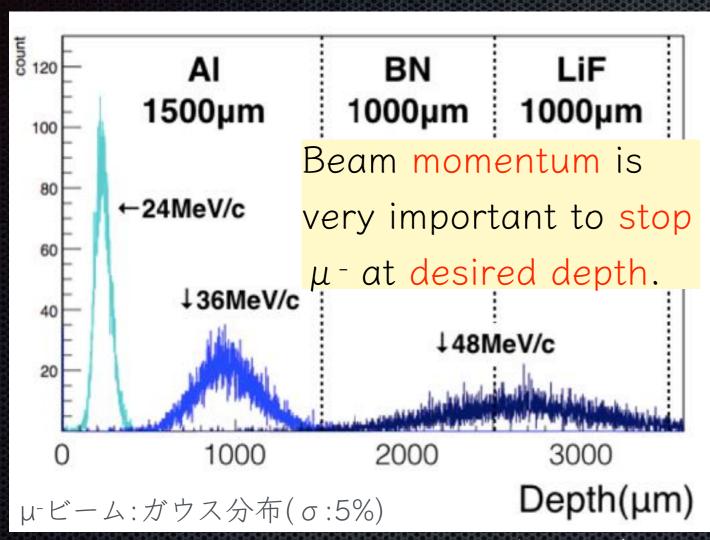


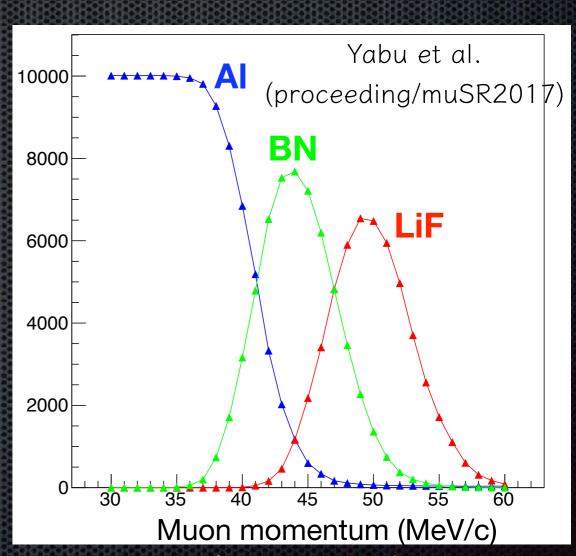
10×10 mm²

 2×2 mm²

Momentum control

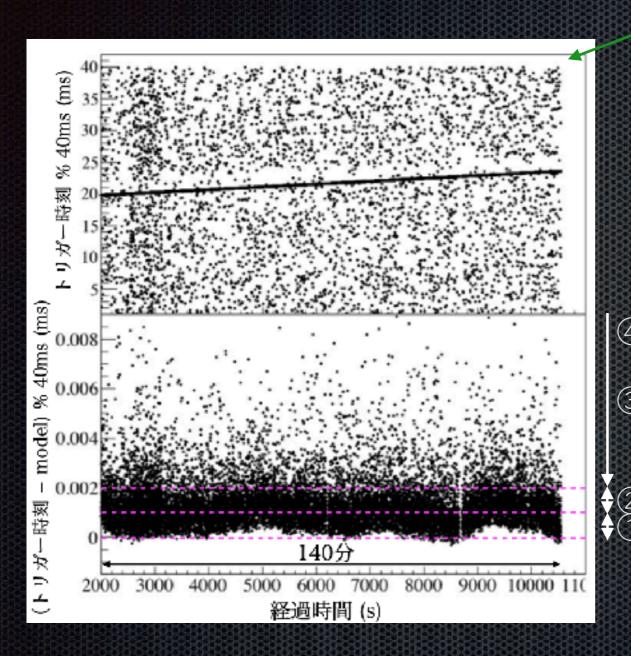
シミュレーション(TRIM)によって物質中の負ミュオンの停止位置を計算し、 運動量を決定する。(TRIM:A MonteCarlo simulator built in SRIM)



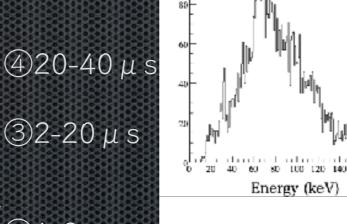


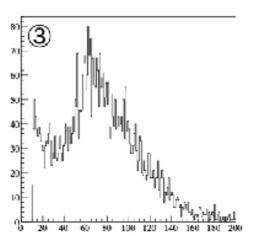
各層に負ミュオンが最大量停止する運動量を採用 (e.g., LiFは50 MeV/c)。

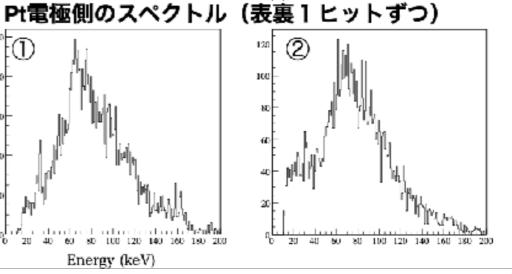
ビームの時間依存性

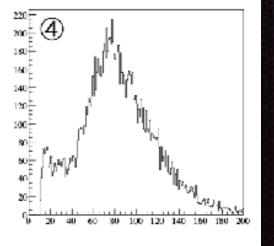


ビームの25Hz(40ms)に由来するイベントを確認。ただし40ms+α。







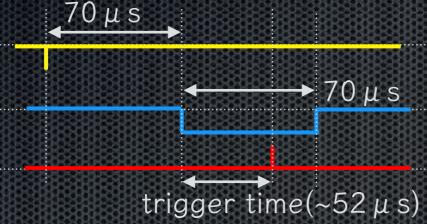


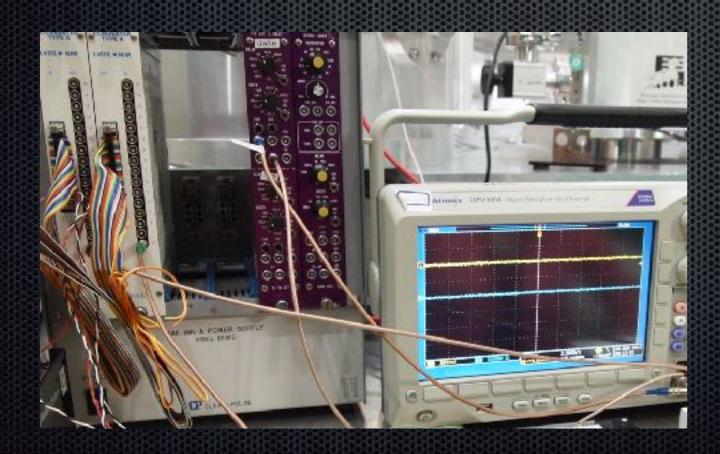
ビームの時間依存性

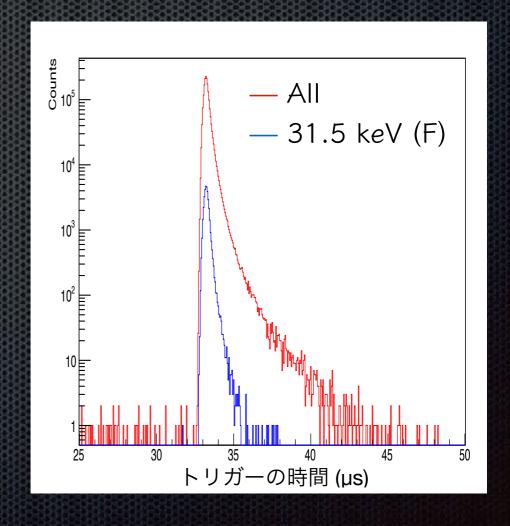
ビームラインからのゲート信号を用いて イベント毎にトリガーの時間を記録。

Trigger of μ beam Gate signal

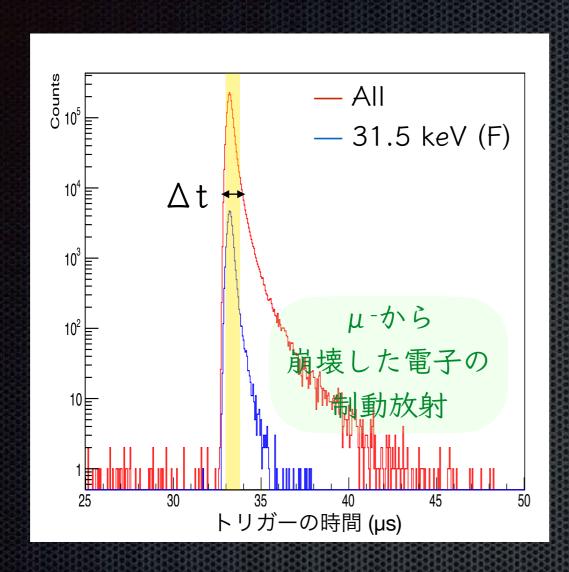
Trigger of detector

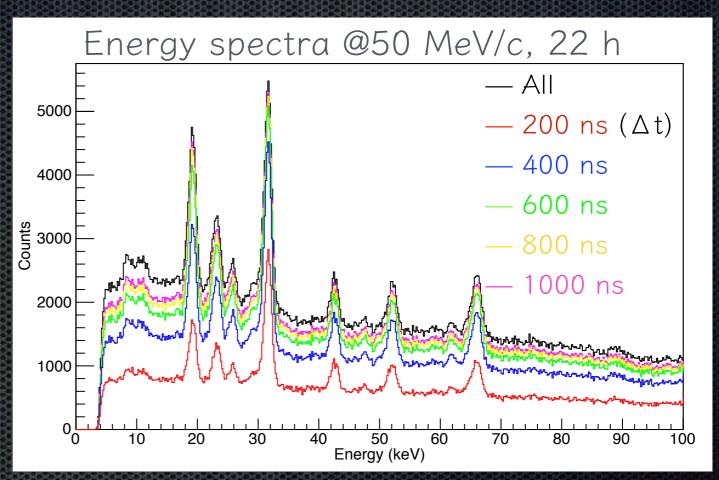






ビームの時間依存性

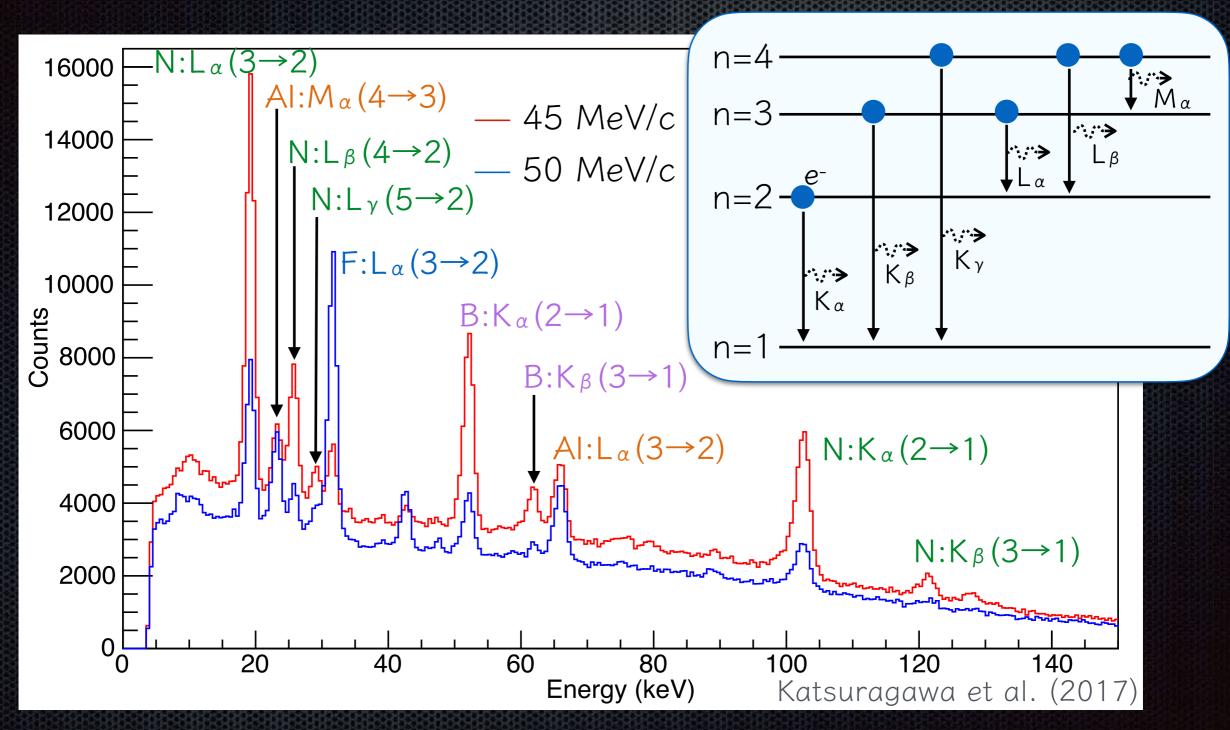




Δtを指定することで、連続成分のみを減らすことができる。

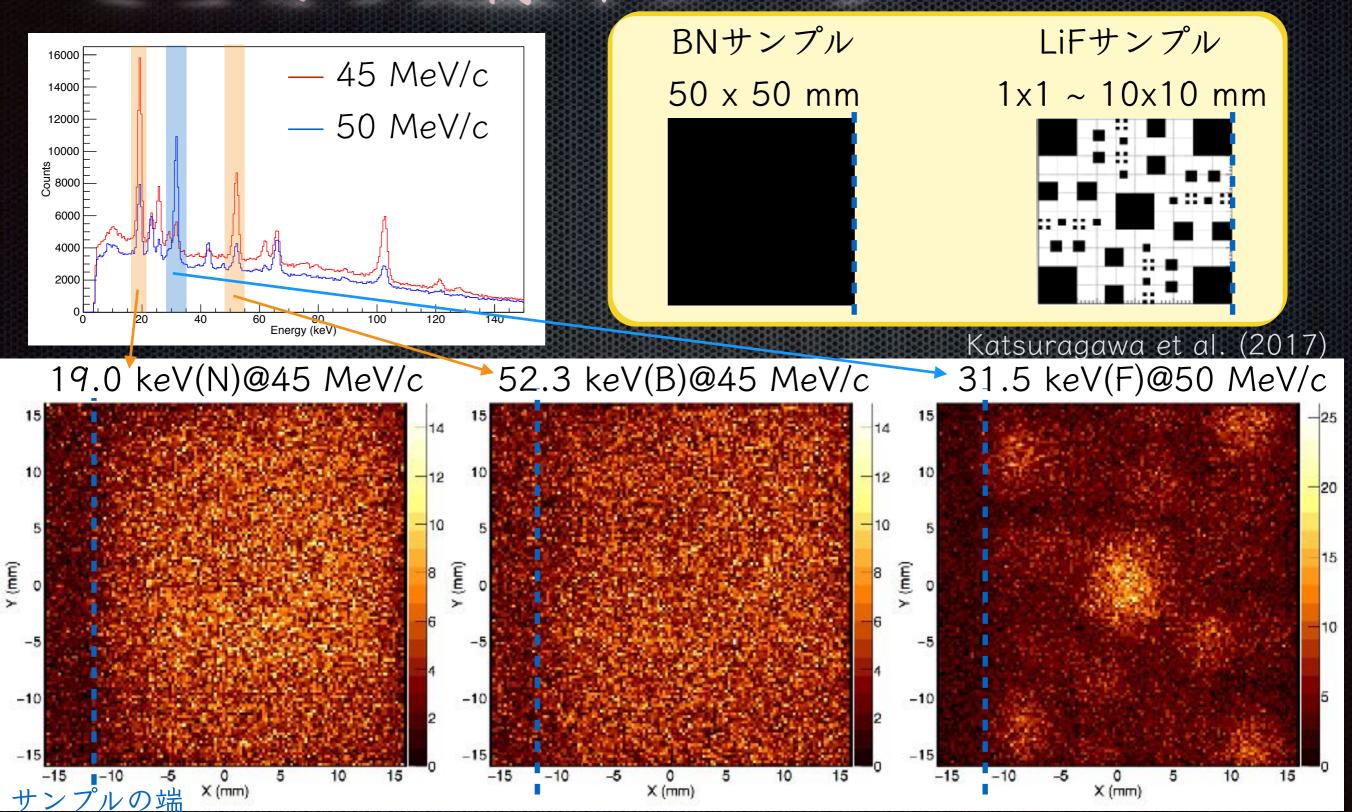
- → 400 ns
- ー>現在は2バンチなので、2箇所Δt₁, Δt₂を使用

ミュオンX線の検出と同定



各層からのミュオンX線を検出(B, N, F)。

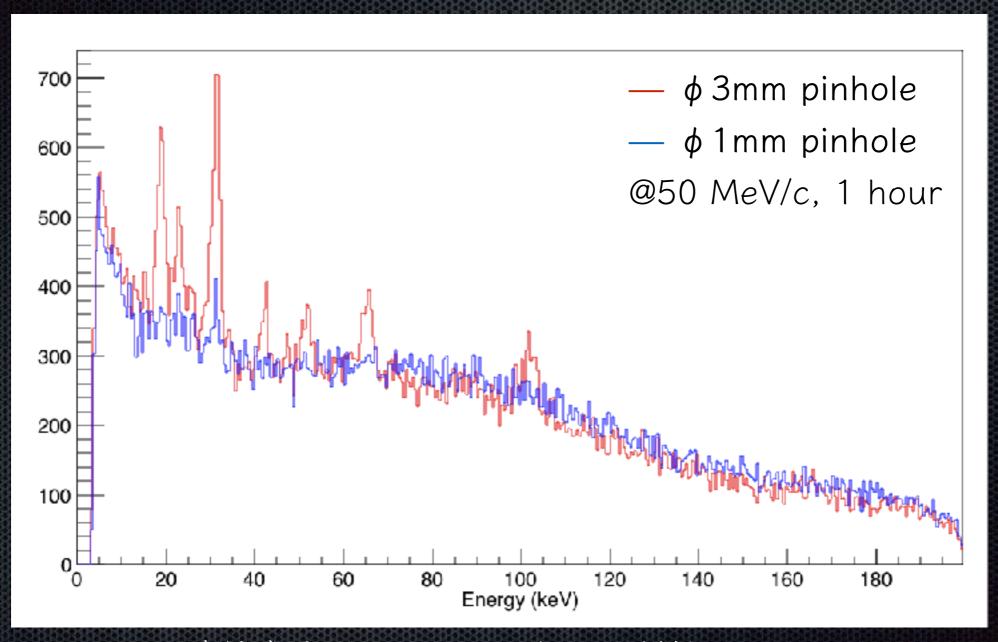
ミュオンX線イメージ



各層のイメージングに成功。ただし、長時間の撮像が必要。

Background study

バックグラウンドのピンホール径への依存性を検証



連続成分とピンホール径に関係性はない。 -> シールドの強化, Multi pinhole, Coded mask

コーデッドマスクによるイメージング

ピンホールコリメーターよりも開口面積が 広く、検出効率の向上が可能。

	Value
Size (mm)	18.3 x 17.7 x 0.3
Material	Tungsten
Minimun element	300 µm
Mask pattern	URA*
Absorption rate	95%

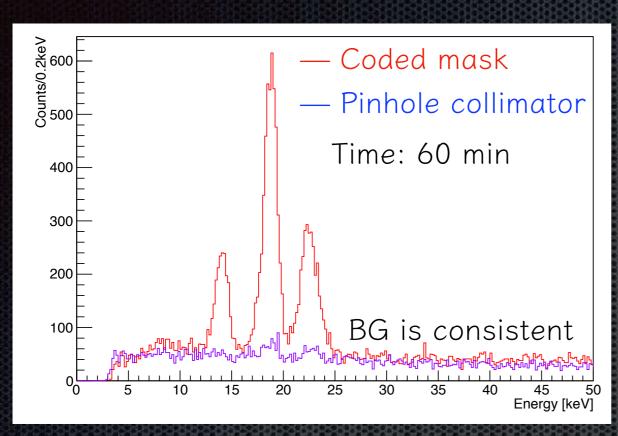
*URA: Uniformly Redundant Array



- ø4 mm x 2 mm
- ø8 mm x 2 mm
- ø8 mm x 0.5 mm
- ø8 mm x 1 mm



コーデッドマスクによるイメージング

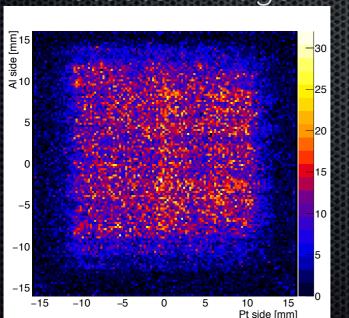


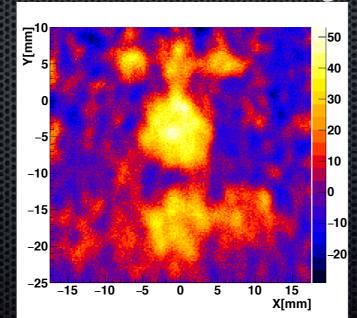
S/N比は大きく改善された(開口面積の差)が、イメージング性能が悪い。

- 視野外からのバックグラウンド成分が再構成の邪魔をしている。
- カウントレートが高く1回の読み 出しで20~30 ch読み出すため位 置の特定がうまくいっていない。

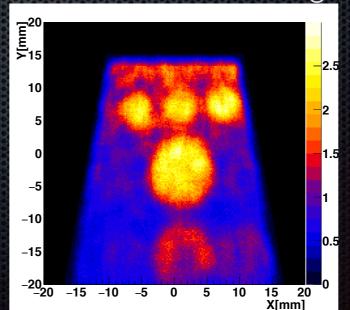
<u>Coded mask</u>







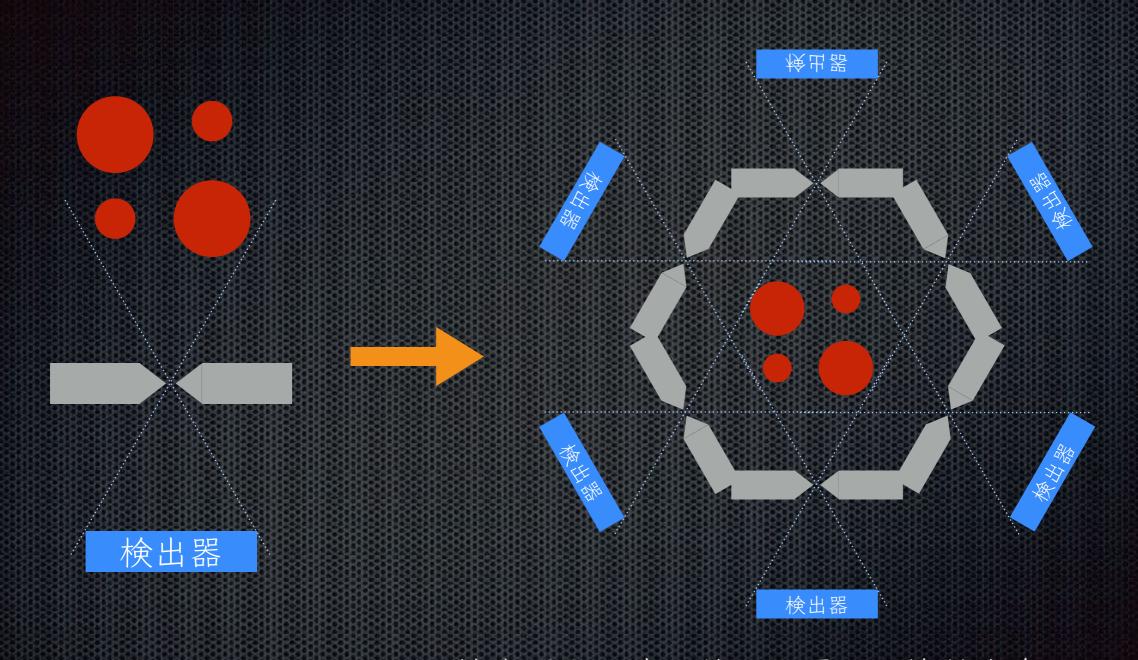
<u>Pinhole collimator</u> Reconstructed image



Time: ~30h

(Oshita Master thesis)

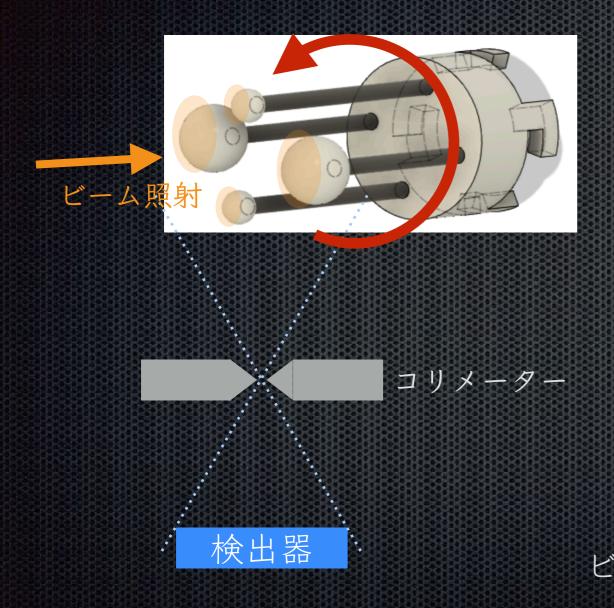
2-Dから3-Dイメージングへ

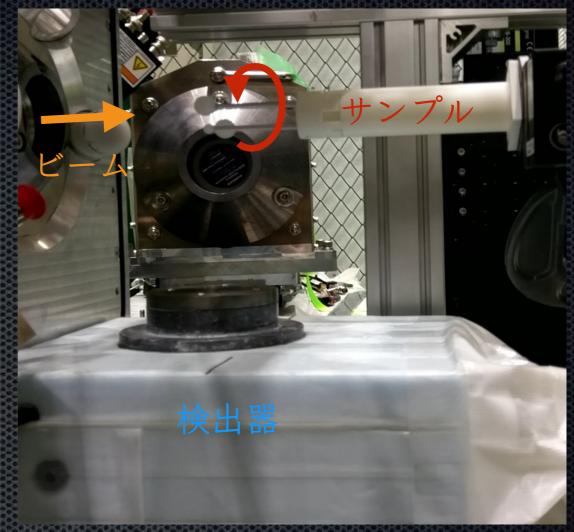


検出器を3次元的に配置し、複数方向からの 2-D画像をもとに3-D画像を再構成する。

模擬実験

3次元構造を持つサンプルを回転させることで、3-Dイメージングの模擬実験を行った。







まとめ

- CdTe-DSDとピンホールコリメーターを用いた小型硬X線撮像器を開発。
- ◆ 世界で初めてのミュオンX線イメージングに成功。
- ルバックグラウンドの低減。
 - Graded Zシールド
 - ・ 加速器に同期したトリガー用ゲート信号
- 今後の課題・取り組み
 - ・ 光学系の最適化(マルチピンホール等)
 - ・ さらなるバックグラウンド成分の低減(G4シミュレーション等)
 - 3-Dイメージングシステムへ拡張
 - はやぶさ2のサンプル撮像に向けた準備

共同研究者:

武田伸一郎、藪悟郎、高橋忠幸(カブリIPMU)、渡辺伸(ISAS/JAXA)、反保元伸、三宅康博(J-PARC) 謝辞:

新学術領域研究(研究領域提案型)「宇宙観測検出器と量子ビームの出会い。新たな応用への架け橋。」